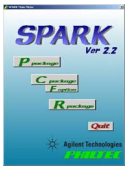
Agilent　PS-X10-100
半導体パラメータ
自動測定ソフトウェア　SPARK



はじめに

半導体パラメータ自動測定ソフトウェア　SPARKは、Agilent半導体パラメータ・アナライザ、容量測定器、スイッチング・マトリクス、および各社のオート/セミオートプローバのドライバを標準装備し、プログラミング無しで簡単に自動測定を実現するソフトウェアです。

測定条件・Waferマップ・測定チップを設定後、測定開始ボタンを押すだけで、自動的に測定を連続して行うことができます。また、測定後にはデータの統計解析機能を使って、データの加工、切り出しを行うことができます。

100種類もの一般的によく使用される測定手法（測定アルゴリズム）を標準装備しています。こちらを参考にしていただくことで短期間でのシステム導入が可能です。

また、お客様ご自身で測定アルゴリズムをカスタマイズをすることができます。オプションにて測定アルゴリズムのカスタマイズ等のご用命も承っております。

3種類のパッケージから必要な測定パッケージを選択できます。また、将来にわたりお使いいただけるよう、他のパッケージを追加購入して機能拡張をすることができます。

特長

◆3種類のパッケージ

「パラメトリック測定パッケージ（P package）」、「特性評価パッケージ（C package）」「信頼性評価パッケージ（R package）」の3種類のパッケージがございます。また、「特性評価パッケージ」では、「HFCVオプション」も選択できます。

◆さまざまな測定・評価アルゴリズムが付属

半導体デバイスのウェーハレベルからディスクリート部品まで、さまざまな測定や評価アルゴリズムを標準付属しています。

◆自動測定システムを構築

オート/セミオートプローバを使用した自動測定環境を提供します。測定シーケンスの制御やプロービング・パターンの設定ができます。

◆アルゴリズム作成が容易

お客様ご自身でアルゴリズム作成や機能追加を行うことができます。

◆オフライン環境

測定アルゴリズム開発やデータ解析用としてオフラインパッケージが付属しており、測定システムが稼働中でも他のPCを用いてデータ解析を行うことができます。

パラメトリック測定パッケージ （P package）

4062や4070/80シリーズの様な測定機能やユーザーインタフェースを持ち、多量パラメータの自動測定に最適です。約100項目の標準的な測定アルゴリズムを内蔵しています。

特性評価パッケージ （C package）

IV、CVなどのSweep測定を連続して自動的に行うことができます。またSweep測定データからVthなどのパラメータを算出することができます。約100項目の標準的な測定アルゴリズムを内蔵しています。

C package HFCVオプション

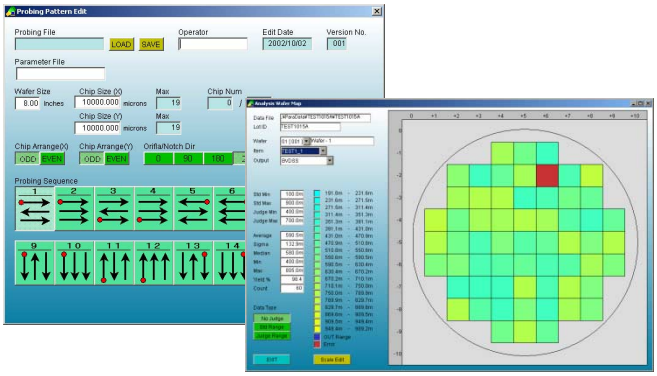
極薄ゲート絶縁膜の測定に必要な4294Aによる高周波CV測定を行うことができます。

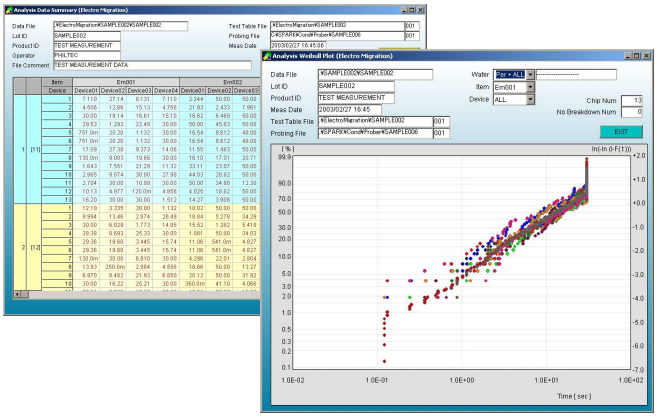
信頼性評価パッケージ （R package）

信頼性評価を自動的に行うことができます。TDDB、TZDB、ホットキャリア、チャージポンプ、エレクトロマイグレーションなどがあり、必要な評価項目を選択できます。

各パッケージ共通仕様

プロービングパターン作成
データ解析
　サマリ表示
　マップ表示
　グラフ表示
　Microsoft Excelへのデータ出力
リーク測定
スイッチングマトリクス制御





動作環境

推奨
　OS:　Windows XP Professional
　　Windows 7 Professional
　CPU：Pentium Ⅲ 500MHz 以上 (XP), 1GHz以上 (7)
　メモリ：256MB以上 (XP), 1GB以上 (7)
　GP-IB　I/F：Agilent　82350B, 82357A, 82357B
測定器
　IV測定
　－B1500A, B1505A
　－E5270A、B
　－4155/56　B/C
　－4142B
　－41000
　CV測定
　－B1520A MFCMU (B1500A/B1505A用、SCUU対応)
　－E4980A
　－4294A
　－4284A
　PGU
　－81110A
　－B1525A HV-SPGU(B1500A用)
　SWM
　－B2200/01A
　－E5250A
プローバ
　カスケード・マイクロテック　S300、Summit12K
　ベクターセミコン　AX-2000、VX-3000
　日本マイクロニクス　AP-80
　ズース・マイクロテック　Prober Bench
　東京エレクトロン　P8、P12、19S、20S
　東京精密　APM60A、UF200、UF3000
上記以外の測定器、プローバも対応が可能です。

ソリューションご提供内容

・ソフトウェア一式、取扱説明書他(Windows help形式)
・ソフトウェア使用権(USBキーによるライセンス)
・納入時の操作説明
・納入後3ヶ月の無償サポート(お電話/Email)
・アルゴリズム開発/データ解析用オフラインパッケージ
・ソフトウェアのカスタマイズ(オプション)
・計測システムのコンサルティング(オプション)

アジレント・テクノロジー株式会社
本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口

受付時間9:00-18:00(土・日・祭日を除く)

TEL ■■ 0120-421-345
　　(042-656-7832)
FAX■■ 0120-421-678
　　(042-656-7840)
Email　contact_japan@agilent.com
電子計測ホームページ
　　www.agilent.co.jp

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際にご確認ください。

©Agilent Technologies. Inc. 2014

Published in Japan, March 17, 2014
5990-7253JAJP
0000-08A

Agilent Technologies